

Test de circuitos integrados VLSI y sistemas robustos.

Petrashin, Pablo Antonio dir. (2016) *Test de circuitos integrados VLSI y sistemas robustos*. [Proyecto de Investigación]

El texto completo no está disponible en este repositorio.

Resumen

El objetivo general será la búsqueda de arquitecturas circuitales que permitan el fácil testeo del chip, la robusticidad ante daños por radiación y su implementación en tecnologías CMOS.

Tipología documental: Proyecto de Investigación

Palabras clave: Microelectrónica. Fallas. Sistemas Robustos.

Descriptores: [T Tecnología > TK ingeniería eléctrica. Ingeniería electrónica nuclear](#)

Unidad Académica: [Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ingeniería](#)